# Рентгеновская эмиссионная и рамановская спектроскопия наноконденсатов CN<sub>0 ≤ x ≤ 0.5</sub>, полученных импульсным дуговым распылением графита в присутствии азота

© В.Р. Галахов, Ю.С. Поносов, С.Н. Шамин, А.П. Рубштейн, А.Б. Владимиров, В.А. Югов, И.Ш. Трахтенберг

Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук, 620041 Екатеринбург, Россия E-mail: galakhov@ifmlrs.uran.ru

(Поступила в Редакцию 27 июня 2007 г.)

На основе анализа рентгеновских эмиссионных спектров пленок  $CN_{0\leq x\leq 0.5}$ , полученных имульсным дуговым распылением графита в присутствии азота, подтверждена нанокомпозитная структура конденсата по типу DLC–C<sub>2</sub>N.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты № 05-02-16780 и 07-02-00540), Интеграционного проекта СО РАН–УрО РАН и проекта "Ведущие научные школы Российской Федерации" (грант НШ-4192.2006.2).

PACS: 78.30.-j, 81.05.Uw, 82.80.Ej

## 1. Введение

Интерес к исследованию углерод-азотных структур обусловлен как с научной, так и с практической точки зрения. Твердые алмазоподобные углеродные покрытия (в английской литературе — diamond-like carbon, DLC) характеризуются высокими прочностными и фрикционными свойствами, определяющими их широкое использование. Фазы на основе  $CN_x$  по твердости могут не уступать алмазам [1,2]. Пленки  $CN_x$ , напыленные без азота при комнатной температуре, характеризуются алмазоподобными свойствами, имеют примерно 80% химических связей  $sp^3$  [3] и могут рассматриваться как нанокомпозитные структуры, имеющие фуллереноподобные частицы в DLC-матрице [4].

Характеризация алмазоподобных углеродных покрытий представляет собой довольно сложную проблему. Популярный метод рентгеновской дифракции не может быть использован для анализа структуры аморфных материалов. Химический анализ алмазоподобных углеродных покрытий можно проводить с помощью метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии [5,6]. Однако интерпретация этих данных неоднозначна из-за перекрывания пиков в рентгеновских фотоэлектронных спектрах остовных уровней.

Для характеризации алмазоподобных углеродных покрытий — анализа структуры и отношения  $sp^3/sp^2$ связанных атомов в пленках аморфного углерода широко используется метод рамановской спектроскопии (спектроскопии комбинационного рассеяния — КРС). Несмотря на то что при возбуждении спектров в видимой области вследствие большого сечения рассеяния (которое в 100–200 раз превосходит сечение рассеяния от  $sp^3$ -элементов) доминирует рассеяние от  $sp^2$ -мест, многочисленные исследования [7–10] показали корреляцию особенностей в спектарх КРС с содержанием элементов с тетраэдрической координацией  $(sp^3)$ , определенной независимо другими методами. Это позволяет использовать быстрый и неразрушающий метод для характеристики структуры пленок, полученных с применением различных технологий, при исследовании эволюции двух основных особенностей рамановских спектров — так называемых *D*- и *G*-пиков. *G*-пик вблизи 1600 cm<sup>-1</sup> обусловлен антифазными колебаниями пар углеродных атомов в различных элементах структуры (кольцах, цепочках). Пик D вблизи 1350 сm<sup>-1</sup> — "дыхательная" мода углеродных колец, проявляющаяся в спектрах при наличии беспорядка. Влияние азота на микроструктуру и свойства углеродных пленок исследовалось во многих работах [3,11]. Было показано, что содержание  $sp^3$ -связанных мест в тетраэдрически связанных аморфных пленках (ta-C:N), полученных с фильтрованным дуговым разрядом, линейно уменьшается до ~ 30% при увеличении азотной концентрации до 35 at.% [12]. При этом в рамановских спектрах, измеренных с возбуждением в видимой области, наблюдались эффекты упорядочения *sp*<sup>2</sup>-связанных атомов. Данный факт указывает на то, что упорядочение и преобразование  $sp^3 \rightarrow sp^2$  происходят достаточно независимо друг от друга. Для более однозначной оценки содержания тетраэдрической фазы в таких случаях требуются измерения с возбуждением в ультрафиолете.

На наш взгляд, для характеризации алмазоподобных углеродных покрытий весьма эффективно также использовать метод рентгеновской эмиссионной спектроскопии. Высокая чувствительность рентгеновских эмиссионных спектров к особенностям химической связи позволяет устанавливать локальную атомную структуру материалов и анализировать характер химических связей. Рентгеновские эмиссионные  $C K_{\alpha}$ - и N  $K_{\alpha}$ -спектры возникают благодаря переходу электронов с 2*p*-уровней на вакансии в 1*s*-уровне и вследствие дипольных правил

отбора отображеют распределение парциальных плотностей электронных С 2*p*- и N 2*p*-состояний соответственно. Исследования тонких пленок  $CN_x$  методом рентгеновской эмиссионной спектроскопии выполнены в работах [13–15], в которых была показана возможность использования этого метода для установления особенностей химических связей и характеризации объектов на основе углерода и азота.

Таким образом, целью настоящей работы было определение типа химической связи в алмазоподобных углеродных пленках C:N методами рентгеновской эмиссионной спектроскопии и рамановской спектроскопии.

## 2. Особенности эксперимента

Пленки  $CN_{0 \le x \le 0.5}$  толщиной  $1-3 \mu m$  были напылены на стальную подложку импульсным дуговым распылением графита в вакууме или в атмосфере азота при парциальном давлении  $10^{-2} < P_N < 5$  Ра с частотой 3 Hz. Температура образцов в процессе напыления не превышала  $100^{\circ}$  С.

Спектры КРС возбуждались излучением аргонового ионного лазера с мощностью до 5 mW и энергией 2.41 eV (514 nm), сфокусированным в пятно на образце диаметром  $\sim 3\,\mu m$ . В пленках, содержащих азот, использование максимальной мощности, как привило, приводило к существенному локальному нагреву и изменению спектров, поэтому воспроизводимые результаты были получены при уменьшении падающей мощности на порядок. Для описания пиков G и D использовалась следующая комбинация: контур Брейта-Вигнера-Фано (BWF) асимметричной формы для пика G и лоренциан для пика D с учетом линейного фона [7–10]. При подгонке спектров четырех первых образцов спектры хорошо описывались одним BWF-контуром, т.е. интенсивность линии D эффективно была равна нулю. Для описания спектров пленок, полученных при наивысшем давлении, требовалось введение лоренциана для Д-линии вблизи  $1320 \,\mathrm{cm}^{-1}$ .

Рентгеновские эмиссионные С  $K_{\alpha}$ - и N  $K_{\alpha}$ -спектры измерены на рентгеновском спектрометре PCM-500 при электронном возбуждении при напряжении на рентгеновской трубке около 6 kV. Погрешность в определении энергетического положения максимумов спектров составляла  $\pm 0.2$  eV. Длдя калибровки N  $K_{\alpha}$ -спектров использовалась Ti Ll-линия металлического титана (энергия 395.3 eV [16]). Калибровку С  $K_{\alpha}$ -линий проводили по Rh  $M\xi$ -линии (энергия максимума 260.1 eV [16]).

# 3. Результаты и их обсуждение

На рис. 1 представлены спектры КРС исследованных углеродных пленок. Для чисто углеродного образца  $CN_0$  спектр содержит слабо асимметричный пик при 1571 ст<sup>-1</sup>. Именно такие спектры характерны для пленок с высоким содержанием  $sp^3$ -связей (80–85%), при-



**Рис. 1.** Спектры рамановского рассеяния  $CN_x$ -пленок, измеренные при возбуждении фотонами с энергией 514 nm при комнатной температуре. Точки — экспериментальные спектры, линия — результат подгонки контуром BWF асимметричной формы для пика G и лоренцианом для пика D с учетом линейного фона.

чем рассеяние в низкочастотной области приписывается колебаниям пар углеродных атомов преимущественно в цепочках. Добавление азота практически не изменяет спектр: спектры образцов  $CN_0$  и  $CN_{0.02}$  подобны. При дальнейшем добавлении азота пик *G* смягчается до 1536 сm<sup>-1</sup>. Качество подгонки и параметры линии *G* для образца  $CN_{0.25}$  практически не меняются при введении дополнительного лоренциана для линии *D*. Отношение интенсивностей  $I_D/I_G$  здесь не превышает 0.05, а частота *G* спика смягчается до 1525 сm<sup>-1</sup>. Интенсивность пика *D* существенно возрастает в  $CN_{0.5}$ , где



**Рис. 2.** Положение *G*-пиков и отношение интенсивностей  $I_D/I_G$  как функции  $sp^3$ -фракции. Калибровочные прямые воспроизведены по данным работы [8].

 $I_D/I_G = 0.2$ , а пик G сдвигается в сторону высоких частот до 1542 сm<sup>-1</sup>. Асимметрия пика G резко возрастает в образцах, содержащих азот, а его ширина несколько уменьшается с 290 сm<sup>-1</sup> в образце CN<sub>0</sub> до 250 сm<sup>-1</sup> в образце CN<sub>0.5</sub>. Как показано в работах [7–9], уменьшение частоты G-пика при практически нулевой интенсивности D-пика является достаточным условием для оценки изменений количества  $sp^3$ -связанных атомов на основе трехстадийной модели аморфизации/упорядочения в углеродных пленках [8–10].

Полученные данные могут быть объяснены уменьшением доли sp<sup>3</sup>-связанных атомов при увеличении содержания азота в пленке. Используя калибровочные графики работ [8–10], можно оценить долю *sp*<sup>3</sup>-фракции (рис. 2). Так, например, для CN<sub>0</sub> вклад *sp*<sup>3</sup>-фракции составляет примерно 80%, а с  $CN_{0.5}$  — примерно 15%. Уменьшение частоты G-пика обусловлено увеличением числа *sp*<sup>2</sup>-связанных атомов, однако, по-видимому, при уменьшении доли *sp*<sup>3</sup>-связей до 20% еще не происходит упорядочения появляющихся ароматических групп в кластеры. О возникновении графитоподобных структур, включающих кольца различного порядка, свидетельствует развитие *D*-пика после уменьшения доли *sp*<sup>3</sup>-мест до 20%. При дальнейшем увеличении содержания азота в пленках начинается переход от аморфного состояния к нанокристаллическому графиту, при этом частота G-пика начинает возрастать вследствие роста кристаллитов графитоподобных структур, о чем свидетельствует и наблюдаемое сужение G-пика.

Выводы о переходе от *sp*<sup>3</sup>- к *sp*<sup>2</sup>-связи с ростом концентрации азота подтверждаются рентгеноспек-

тральными исследованиями. Согласно правилам отбора, Ка-спектры возникают при переходе электронов  $2p \rightarrow 1s$  и, следовательно, отображают распределение 2р-состояний в занятой части валентной полосы. Таким образом, рентгеновские эмиссионные С  $K_{\alpha}$ - и N  $K_{\alpha}$ спектры дают информацию о типе химической связи в пленках CN<sub>x</sub>. На рис. 3, а представлены рентгеновские эмиссионные С K<sub>a</sub>-спектры CN<sub>x</sub>-пленок и эталонных образцов: графита (характеризующегося *sp*<sup>2</sup>-связями), аморфного углерода а-С, алмазоподобной пленки, полученной нами ранее в работе [17], и алмаза. Аморфный углерод (a-C) имеет примерно 80% связей  $sp^2$  и 20% связей  $sp^3$  [15]. Спектры пленок CN<sub>0.5</sub> и CN<sub>0.25</sub> практически подобны спектрам а-С и, следовательно, характеризуются примерно таким же отношением  $sp^2/sp^3$ -связей. Эта величина хорошо соответствует оценке sp<sup>3</sup>-содержания с помощью рамановской спектроскопии (рис. 2).

В алмазе атомы углерода формируют сильно гибридизованные тетраэдрические *sp*<sup>3</sup>-связи. Спектр пленки с



**Рис. 3.** *а*) Рентгеновские эмиссионные  $CN_{\alpha}$ -спектры графита, алмаза, аморфного углерода *a*-C, алмазоподобной пленки DLC (спектр воспроизведен по данным работы [17]) и  $CN_x$ -пленок с концентрациями x = 0.5, 0.25 и 0. *b*) Рентгеновские эмиссионные N  $K_{\alpha}$ -спектры  $CN_x$ -пленок (x = 0.5 и 0.25).

нулевой концентрацией азота (CN<sub>0</sub>) идентичен спектру ранее исследованной алмазоподобной пленки [17] с преимущественными связями  $sp^3$ , что также согласуется с оценками, сделанными на основе рамановских исследований.

На рис. 3, *b* приведены рентгеновские эмиссионные N  $K_{\alpha}$ -спектры пленок CN<sub>0.5</sub> и CN<sub>0.25</sub>. Максимум N  $K_{\alpha}$ спектра при энергии фотонов примерно 395 eV соответствует переходам электронов N  $2p\pi \rightarrow 1s$ , а "плечо" спектра при энергии около 392 eV отвечает переходам N  $2p\sigma \rightarrow 1s$ . Эта интерпретация поддерживается измерением резонансных N  $K_{\alpha}$ -спектров CN<sub>s</sub> [14]. N  $K_{\alpha}$ -спектры всех изученных пленок не меняются с изменением содержания x, что означает неизменность локального атомного окружения азота. Таким образом, рост содержания азота в пленках приводит к трансформации атомной структуры от DLC к C<sub>2</sub>N. Координация углерода вокруг азота не изменяется при всех концентрациях азота.

#### 4. Заключение

На основании исследования рамановских и рентгеновских эмиссионных  $CK_{\alpha}$ - и  $NK_{\alpha}$ -спектров пленок  $CN_{0\leq x\leq 0.5}$ , полученных импульсным дуговым распылением графита в присутствии азота, подтверждена нанокомпозитная структура конденсата по типу DLC– $C_2N$ . Показано, что при трансформации структуры от DLC к  $C_2N$  координация углерода вокруг азота не изменяется при всех концентрациях азота и происходит переход от  $sp^3$ - к  $sp^2$ -гибридизации.

### Список литературы

- [1] A.Y. Liu, M.I. Cohen. Science **245**, 845 (1989).
- [2] A.P. Rubshtein, I.Sh. Trakhtenberg, E.G. Volkova, A.B. Vladimirov, A.G. Gontar, K. Uema. Diamond Rel. Mater. 14, 1820 (2005).
- [3] B. Kleinsorge, A.C. Ferrari, J. Robertson, W.I. Milne, S. Waidmann, S. Hearne. Diamond Rel. Mater. 9, 643 (2000).
- [4] N. Hellgren, M.P. Johansson, E. Broitman, P. Sandstrom, L. Hultman, J.E. Sundgren. Phys. Rev. B 59, 5162 (1999).
- [5] D. Marton, K.J. Boyd, A.H. Al-Bayati, S.S. Todorov, J.W. Rabalais. Phys. Rev. Lett. 73, 118 (1994).
- [6] P. Mérel, M. Tobal, M. Chaker. Diamond Rel. Mater. 12, 1075 (2003).
- [7] S. Prawer, K.W. Nugent, Y. Lifshitz, G.D. Lempert, E. Grossman, J. Kulik, I. Avigal, R. Kalish. Diamond Rel. Mater. 5, 433 (1996).
- [8] C. Ferrari, J. Robertson. Phys. Rev. B 61, 14095 (2000).
- [9] C. Ferrari, J. Robertson. Phys. Rev. B 64, 075414 (2001).
- [10] C. Ferrari. Diamond Rel. Mater. 11, 1053 (2002).
- [11] L. Andujar, A. Hart, J. Robertson, W.I. Milne. Diamond Rel. Mater. 9, 663 (2000).
- [12] A.C. Ferrari, S.E. Rodil, J. Robertson. Phys. Rev. B 67, 155 306 (2003).

- [13] H. Izumi, T. Kaneyoshi, T. Ishihara, H. Yoshioka, H. Matsui, M. Motoyama, Y. Muramatsu. X-Ray Spectrometry 28, 509 (1999).
- [14] H. Hellgren, J. Guo, C. Såthe, A. Agui, J. Nordgren, Y. Luo, H. Ågren, J.-E. Sundrgren. Appl. Phys. Lett. 79, 4348 (2001).
- [15] E.Z. Kurmaev, A. Moewes, R.P. Winiarski, S.N. Shamin, D.L. Ederer, J.L. Feng, S.S. Turner. Thin Solid Films 402, 60 (2002).
- [16] J.A. Bearden. Rev. Mod. Phys. 39, 78 (1967).
- [17] E.Z. Kurmaev, S.N. Shamin. Surf. Coating Technol. 47, 628 (1991).